

**О. І. Власенко<sup>1</sup>, В. П. Велещук<sup>1</sup>, З. К. Власенко<sup>1</sup>, М. П. Киселюк<sup>1</sup>,  
П. Г. Литовченко<sup>2</sup>, І. В. Петренко<sup>2</sup>, В. П. Тартачник<sup>2</sup>, М. Б. Пінковська<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ

<sup>2</sup> Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

## **ВПЛИВ НЕЙТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТУЖНИХ InGaN/GaN СВІТЛОДІОДІВ**

Вивчено вплив потоку швидких нейtronів реактора ( $E = 2 \text{ MeV}$ ,  $\Phi = 2 \cdot 10^{14} \text{ н/см}^2$ ) на вольт-амперні та вольт-фарадні характеристики, інтенсивність електролюмінесценції потужних InGaN/GaN світлодіодів на кремнієво-углецевій підкладинці та на кремнієвій підкладинці із золото-олов'яним контактом. Виявлено, що величина та знак зміни тунельних струмів після радіаційного опромінення у світловипромінюючих InGaN/GaN гетероструктурах суттєво залежить від підкладинки.

*Ключові слова:* потужні InGaN/GaN світлодіоди, опромінення, вольт-амперні характеристики.

**А. И. Власенко<sup>1</sup>, В. П. Велещук<sup>1</sup>, З. К. Власенко<sup>1</sup>, М. П. Киселюк<sup>1</sup>,  
П. Г. Литовченко<sup>2</sup>, И. В. Петренко<sup>2</sup>, В. П. Тартачник<sup>2</sup>, М. Б. Пинковская<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарьева НАН Украины, Киев

<sup>2</sup> Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

## **ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНЫХ InGaN/GaN СВЕТОДИОДОВ**

Изучено влияние потока быстрых нейтронов реактора ( $E = 2 \text{ MeV}$ ,  $\Phi = 2 \cdot 10^{14} \text{ н/см}^2$ ) на вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики, интенсивность электролюминесценции мощных InGaN/GaN светодиодов на кремниево-углеродной подложке и на кремниевой подложке с золото-оловянным контактом. Выявлено, что величина и знак изменения туннельных токов после радиационного облучения в светоизлучающих InGaN/GaN гетероструктурах существенно зависит от подложки.

*Ключевые слова:* мощные InGaN/GaN светодиоды, облучение, вольт-амперные характеристики.

**A. I. Vlasenko<sup>1</sup>, V. P. Veleschuk<sup>1</sup>, Z. K. Vlasenko<sup>1</sup>, M. P. Kisselyuk<sup>1</sup>,  
P. G. Lytovchenko<sup>2</sup>, I. V. Petrenko<sup>2</sup>, V. P. Tartachnyk<sup>2</sup>, M. B. Pinkovska<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

<sup>2</sup> Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

## **EFFECT OF NEUTRON IRRADIATION ON CHARACTERISTICS OF POWER InGaN/GaN LIGHT-EMITTING DIODES**

Effect of the fast neutron flux reactor ( $E = 2 \text{ MeV}$ ,  $\Phi = 2 \cdot 10^{14} \text{ н/см}^2$ ) on the current-voltage, capacitance-voltage characteristics, the electroluminescence intensity of power InGaN/GaN LEDs on the SiC and AuSn/Si substrates are studied. It was revealed that radiation hardness of InGaN/GaN heterostructures depend on the substrate.

*Keywords:* power InGaN/GaN light emitting diode, irradiation, current-volt characteristic.

## **REFERENCES**

1. Li C.S. Radiation Effects in III-V Compound Semiconductor Heterostructure Devices. - M.S. thesis, Oregon State University, 2002.
2. Polyakov A.Y., Pearson S.J., Frenzer P. et al. Radiation effects in GaN materials and devices // J. Mater. Chem. C. - 2013. - No. 5. - P. 877 - 887.
3. Kim H.-Y., Kim J., Ren F., Jang S. Effect of neutron irradiation on electrical and optical properties of InGaN/GaN light-emitting diodes // J. Vac. Sci. Technol. B. - 2010. - Vol. 28, No. 27. - P. 3268136.
4. Bojko V.M., Brudnyj V.N., Verevkin S.S. et al. // FTP. - 2014. - Vol. 48, Iss. 7. - P. 885 - 889. (Rus)
5. Brudnyj V.N., Kosobutskij A.V., Kolin N.G., Korulin A.V. // FTP. - 2011. - Vol. 45, Iss. 4. - P. 461 - 467. (Rus)
6. Bojko V.M., Verevkin S.S., Kolin N.G. et al. // FTP. - 2011. - Vol. 45, Iss. 1. - P. 136 - 142. (Rus)
7. Gradoboev A.V., Rubanov P.V., Skakova I.M. // Izv. VUZov. Fizika. - 2011. - No. 1/2 - P. 190 - 194. (Rus)
8. Gridin V.N., Ryzhikov I.V., Vinogradov V.S. // Izv. VUZov. Elektronika. - 2009. - No. 1 (75). - P. 27 - 32. (Rus)
9. Haerle V., Hahn B., Kaiser S. et al. High brightness LEDs for general lighting applications Using the new ThinGaN™-Technology // Phys. Stat. Sol. (a) - 2004. - Vol. 201, No. 12. - P. 2736 - 2739.
10. Konoreva O., Opilat V., Pinkovska M., Tartachnyk V. Features of current-voltage characteristics inherent to GaP

- light-emitting diodes with quantum wells // SPQE. - 2006. - Vol. 9, No. 4. - P. 45 - 48.
11. *Kolyadenko I.V., Lytovchenko P.G., Opylat V.Ya. et al.* // Fizyka i khimiya tverdogo tila. - 2006. - Vol. 7, No. 1. - P. 184 - 188. (Ukr)
12. *Belyaev A.E., Boltovets N.S., Konakova R.V. et al.* // FTP. - 2010. - Vol. 44, Iss. 4. - P. 467 - 475. (Rus)
13. *Bochkareva N.I., Zhirnov E.A., Efremov A.A. et al.* // FTP. - 2005. - Vol. 39, Iss. 7. - P. 829 - 833. (Rus)
14. *Sobolev M.M., Sobolev N.A., Usikov A.S. et al.* // FTP. - 2002. - Vol. 36, Iss. 12. - P. 1437 - 1439. (Rus)

Надійшла 01.10.2015  
Received 01.10.2015